イオン注入により組成混晶化した量子ドットレーザの温度特性の検討

Thermal Properties of Implantation-Induced Intermixed Quantum Dot Laser Diode

情通機構¹, 早大理工², 早大 GCS 機構³

^O松本敦¹,赤石陽太²,伊澤昌平²,松島裕一³,宇高勝之²

NICT¹, Waseda Univ.^{2,3}, °A. Matsumoto¹, Y. Akashi², S. Isawa², Y. Matsushima³, and K. Utaka²

E-mail: a-matsumoto@nict.go.jp

研究背景 近年、通信容量が急激に増大し、特にモバイルやデータセンタ等の中短距離通信トラフィ ックの増加が顕著である。そのため Si photonics に基づいた光集積回路(PIC: Photonic integrated circuit) による小型・高速・大容量なトランシーバや LSI と PIC を集積したデバイスなどが多数報告され、低 コストで大容量通信可能なネットワークに向けた研究がされている[1]。一方、これまで我々のグルー プでは、高性能な光デバイスを実現するための材料・ナノ構造として期待されている量子ドット(QD: Quantum Dot)に注目し、イオン注入を用いた QD 組成混晶化技術(QDI: Quantum dot intermixing)を 検討してきており[2]、結晶再成長を用いずに QD モノリシック光集積回路を作製し、その基礎的な特 性も示してきた[3]。本稿では、QDI により発振波長をシフトした LD を作製し、その温度特性を評価 した結果、従来の QD-LD よりも良好な特性が得られたので報告する。

実験・測定結果 実験では、InAs QD と InGaAlAs を 30 層積層した活性層と、p-, n-InAlAs クラッド層 と p+-InGaAs コンタクト層から成るウェハを結晶成長し、このウェハに Ar イオンをイオン注入し、RTA (Rapid thermal annealing) を行うことで QDI を生じさせたものを用いてブロードエリア (BA: Broad area) 構造の LD を作製した。また、QDI 未実施のウェハで作製した QD-LD も作製し、レーザ特性の 比較を行った。QDI のプロセスに関して、イオン注入は加速電圧 120 keV, ドーズ量を 1×10¹⁴ cm⁻²で 実施し、RTA は 680℃、120 s とした。また、BA-LD の構造に関して、共振器幅は 50 µm, 共振器長は

600 ~ 1400 μm のものを作製した。これら2種類の QD-LD の発振閾値電流密度の温度依存性を図1に示す。そして、図2に QDI プロセスを実施したウェハで作製し

た QD-LD の 30, 50, 70°Cにおける発振スペクトル ($P_{out} = 5 \text{ mW}$, $I_{op} \approx 1.2 I_{th}$) を示す。図1に示したように、QDIによる QD -LD は特に高温領域で発振閾値の変動が小さい特性が得られた。通 常の QD-LD では 15 ~ 30°Cと 50 ~ 80°Cにおける特性温度 T₀ は それぞれ 120 K, 65 K であったのに対し、QDI プロセスを実施 した QD-LD の T₀ はそれぞれ 130 K, 580 K であった。さらに発 振スペクトルに関しても図2に示したように、温度変化による ピーク波長のシフト量も QDI 処理を行った LD は非常に抑制さ れ、QDI 未実施の QD-LD では 0.52 nm/°Cに対してその値は 0.15 nm/°Cであり、約 3 分の一であった。明確な要因は今後さらに 検討する必要があるものの、組成拡散された QD は界面原子の 熱的な拡散により基底準位のエネルギーばらつきが大きくな り、一方高温動作時はバンドギャップがレッドシフトするもの の、キャリアが高エネルギー側に分布することで、発振波長の 変動が抑制されたと推定される。

まとめ 本研究では QDI を行った LD の温度特性を検討し、 従来の QD-LD よりも良好な温度特性を有することを示した。

謝辞本研究の一部は、総務省の「電波資源拡大のための研究開発」、 科学技術振興機構 CREST (JPMJCR17N2),日本学術振興会科研費基 盤 A (JP17H01277)の一環として実施された。

参考文献

T. Shi, et al., Proc. OFC2018, M3F.4 (2018).
A. Matsumoto et al., Appl. Phys. Express, Vol. 7, pp. 092801-1 -

(2) A. Matsumoto et al., Appl. Phys. Express, vol. 7, pp. 092801-1 - 092801-3 (2014).

[3] S. Matsui, et al., Proc. CSW2016., MoP-IPRM-028 (2016).



Fig. 1 Relationship between the threshold current density and temperature of as-grown and QDI LDs.



Fig. 2 Lasing spectra of QDI LD at 30 °C, 50 °C, and 70 °C.